

Patentrecherchen – von der Entwicklung bis zur Vermarktung

Quellen, Strategien, Analysen

Elke Thomä, Oldenburg, 15. Februar 2010

Agenda

Nutzen der Patentinformation

Typische Rechercheanfragen und Recherchearten

Medien für Patentinformation

Recherchemöglichkeiten – Beispiele

Durchführung von Patentrecherchen

Zusammenfassung: Recherchemöglichkeiten

Nutzen der Patentinformation

- Einzigartige und aktuelle Quelle für **Rechtsinformation, Technikinformation** und **Marktinformation**
- 80 % der wissenschaftlichen und technischen Neuerungen werden nur in Patenten offenbart
- Schutzfunktion \leftrightarrow Publikationsfunktion
Viele Firmen haben kein Interesse an wissenschaftlichen Publikationen, wollen aber die Schutzfunktion der Patente
→ aber nach 18 Monaten wird immer publiziert
- Patente haben weltweit eine uniforme Struktur
- Patente (Volltexte) sind weitgehend kostenfrei zu beschaffen
- Die Erfindungen von nichterteilten oder abgelaufenen Patenten können frei genutzt werden → nur 10% der Lösungen aus Patentdokumenten sind geschützt

Rechtsinformation

- **Schutz vor Verletzungen eigener Schutzrechte durch andere Firmen**
- **Um die Schutzrechte einer anderen Firma nicht zu verletzen**

Technikinformation

- **Technische Beschreibung fast aller Produkte**
- **Erkennen von aktuellen technischen Entwicklungen**
- **Anregungen und Ideen für:**
 - neue Produkte und Verfahren
 - neue Anwendungen von existierenden Produkten
- **Vermeidung von Doppelarbeit in Forschung und Entwicklung**

Marktinformation / wirtschaftliche Bedeutung

- **Auffinden neuer Marktmöglichkeiten**
 - Lizenzen
 - Vermarktung von Produkten, deren Patente schon abgelaufen sind
- **Unternehmensbewertung**
- **Handelsobjekt**
- **Sicherungsfunktion**
 - Absicherung von Investitionen
 - Absicherung von Unternehmensstrategien
- **Überwachung von Wettbewerbern**
- **Innovationsprognosen**
- **Gezielte Analysen einzelner Technologiebereiche**
 - Ermittlung von Konkurrenten
 - Trendbeobachtung

Probleme mit der Patentinformation

- **Allgemeiner Verständnismangel für das Patentwesen**
- **Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Patentdokumenten**
→ trifft nicht mehr zu
- **Große Anzahl von Dokumenten**
- **Verwendung verschiedener Sprachen**
- **Patentfachsprache**

Typische Rechercheanfragen und Recherchearten

Patentschriften sind eine zuverlässige Informationsquelle. Welchen Informationsbedarf haben Sie?

- **Welche Patente gibt es über *Bremsen, die für Inline-Skates geeignet sind*??**
Sie möchten zu einem Fachgebiet wissen, was bereits bekannt und evtl. geschützt ist oder ob es für Ihr Problem schon eine Lösung gibt. Das ist eine **Sachrecherche**.
- **Welche Patente hat die Atlas Elektronik GmbH aus Bremen?**
Das ist eine **Namensrecherche** nach einem bestimmten Patentanmelder.
- **Welche Patente hat *Karlheinz Brandenburg*?**
Das ist ebenfalls eine **Namensrecherche** nach einem Erfinder.
- **Müssen wir das Patent *US 5,000,075* in Deutschland beachten?**
Das müssen Sie, sofern dieses Patent in Deutschland angemeldet worden ist. Ob dies der Fall ist, kann durch eine **Patentfamilienrecherche** herausgefunden werden. Sie müssen das US-Patent natürlich auch beachten, wenn Sie auch in die USA verkaufen wollen.

- **Gibt es zu der Nummer JP57080923 auch ein Patent in deutscher oder englischer Sprache?**
Eine Recherche nach der **Patentfamilie** zeigt auf, ob dieses Patent auch in anderen Ländern und damit auch in anderen Sprachen angemeldet ist.
- **Ist das Patent Nr. DE 42 08 777 erteilt worden bzw. noch gültig?**
Sie möchten wissen, ob bei einem bestimmten Patent der Schutz z.Z. aktiv ist. Diese Frage ist mit Hilfe einer **Rechtsstandsrecherche** zu beantworten.
- **Welche anderen Patente werden im US-Patent Nr. 5,000,075 zitiert? Wo wird dieses Patent zitiert?**
Sie möchten andere Publikationen mit naheliegenderem Inhalt ermitteln, um Ihre Rechercheergebnisse zu verbessern oder Sie möchten Wettbewerber ermitteln. Diese Fragen sind durch **Zitierungsrecherchen** zu beantworten.
- **Wie lautet der vollständige Text des US-Patentes Nr. 5,000,075?**
In einigen Datenbanken finden Sie den **Volltext** bzw. Seitenimages von Patenten.

Die Recherchearten werden oft miteinander kombiniert.

Medien für Patentinformation







- **Papier**
- **Mikrofilm/Mikrofiche**
- **CD-ROM**
- **Patentinformation im Internet**
 - Informationen der Patentämter, Patentinformationszentren, Dienstleister, Firmen z.B. über Schutzrechte, Gesetze, Formulare usw.
 - Entgeltfreie Datenbanken im World Wide Web
 - Entgeltfreie Volltextbeschaffung
- **Kostenpflichtige Online-Patentdatenbanken**
- **Kostenpflichtige Volltextbeschaffung**

Wichtige Informationsquellen im Internet für den Schutzrechtsbereich

Patentämter, Patentinformationszentren, Dienstleister

- Grundlegendes zu Patenten und anderen Schutzrechten
- Gesetzestexte
- Aktuelle Gesetzesänderungen und Initiativen
- Formulare
- Durchführung von Patentanmeldungen
- Übersetzung von Patentanmeldungen
- Vermarktung von Schutzrechten
- Lizenzangebote
- Dienstleistungsangebote
- Linksammlungen

Wichtige Patentämter

	<p>Europäisches Patentamt (EPA oder EPO)</p> <p>http://www.epo.org</p>
	<p>World Intellectual Property Organization (WIPO)</p> <p>http://www.wipo.int</p>
<p>Deutsches Patent- und Markenamt</p> 	<p>Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)</p> <p>http://www.dpma.de</p>
	<p>United States Patent and Trademark Office (USPTO)</p> <p>http://www.uspto.gov</p>
<p>経済産業省 特許庁 Japan Patent Office</p>	<p>Japan Patent Office</p> <p>http://www.jpo.go.jp</p>
	<p>State Intellectual Property Office of the R.P.C.</p> <p>http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/</p>
	<p>The Korean Intellectual Property Office</p> <p>http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.eng.main.BoardApp</p>

Patentinformationszentren in Deutschland

<http://www.patentinformation.de/>

PATON –
Landespatentzentrum Thüringen der
TU Ilmenau

- **Bildungs- und Beratungszentrum (Fach- und Patentinformation, Patentwesen)**
- **Recherche- und Analysedienste**
- **Recherchesaal**
- **Patentverwertungsagentur**
- **Patentinformationstechnologien (u.a. Patentvolltexte)**
- <http://www.paton.de/>



Entgeltfreie Patentdatenbanken / Volltextbeschaffung im WEB

- Datenbanken für einzelne Länder und **Internationale Datenbanken**
- Die Retrospektivität ist sehr unterschiedlich (2 Jahre bis 200 Jahre)
- Dokumentation des Datenbestands ist nur teilweise vorhanden, Vollständigkeit ist nicht immer gegeben, häufig ohne Hinweise
- Einfache Suchoberflächen, oft mit guter Unterstützung für Rechercheformulierungen
- teilweise eingeschränkte Verknüpfungs- und Trunkierungsmöglichkeiten
- Volltextausgabe: komplette Volltexte kostenfrei bei ESPACENET und DEPATISNET bzw. beim Publikationsserver des DPMA.
- Keine Zusammenführung mehrerer Recherchen möglich
- Die Nachbearbeitung der Recherche wird wenig unterstützt. D.h. man hat keine Datei, die alle Suchanfragen und die Ergebnisse enthält. Die Ergebnisse (Titellisten, Volltexte) sind schwierig zu bearbeiten, aber teilweise schon möglich.
- Kosten entstehen durch Telefon, Provider und Arbeitszeit

- **Zielgruppen:**

Studenten, KMUs, Endnutzer in Großindustrie: einfache Anfragen, Vororientierung, keine vollständigen Recherchen

Patentspezialisten und Rechercheprofis: Vorrecherchen, Volltextausgabe oder Ausgabe von Titelseiten, Nutzung von speziellen Features, die sehr gut angeboten werden

- **Vorteile:** die Patentinformation wird einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht
- **Probleme:** Die Patentinformation wird oft durch Personen mit einem geringen Kenntnisstand über Patentverfahren und Patentdokumentation genutzt. Dadurch kann es sein, dass falsche Schlussfolgerungen aus den Recherchen gezogen werden. Durch die Anbieter wird häufig zu wenig auf die Probleme hingewiesen.

Einige wichtige Adressen

Linksammlungen

- Übersicht über Patentämter und Copyright Offices
<http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>
- Linksammlung des Europäischen Patentamts
<http://www.epo.org/topics/ip-webguide.html>
- Global Intellectual Property: Umfangreiche Linksammlung
<http://www.ipmenu.com/>

Patentdatenbanken und Volltextausgabe

- **Deutsches Patent- und Markenamt**

- **DEPATISNET:** <http://www.depatisnet.de>

internationale Patentdatenbank

Recherche in Deutsch, Englisch u.a.

Pdf-Volltexte

Internationale Patentklassifikation: <http://depatisnet.dpma.de/ipc/>

- **DPINFO:** <https://dpinfo.dpma.de/>

Rechtsstandsauskunft für deutsche Patente und Geschmacksmuster

- **DPMA-Register:** <http://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht>

amtliche Publikationen und Register (derzeit nur für Marken, wird 2009-2010 für alle Schutzrechtsarten eingerichtet und wird DPINFO wird abgeschaltet werden)

- **Europäisches Patentamt**

- **ESPACENET:** <http://ep.espacenet.com/>

internationale Patentdatenbank mit INPADOC-Familie und Rechtsstand

Recherche in englisch

Europäische Patentklassifikation (ECLA):

<http://v3.espacenet.com/eclasrch?CY=ep&LG=de>

- **EPOLINE:** Europäisches Patentregister, Rechstands Auskunft für europäische Patente

<http://www.epoline.org/portal/public>

- **US – Patentamt (USPTO)**

- **US-Patente und US-Patentanmeldungen:**

Volltextdatenbanken

TIF-Volltexte als Einzelseiten

<http://www.uspto.gov/patft/index.html>

- **PAIR** (Patent Application Information Retrieval) : Rechtsstandsauskunft für US-Patente

<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>

Kostenpflichtige Online-Patentdatenbanken und Volltextbeschaffung

Patentdatenbanken mit Jahresgebühren / Flatrate

- **Internationale familienbezogene Datenbanken oder Zusammenstellung einiger Datenbanken mit einfachen bis zu sehr gut ausgebauten Benutzeroberflächen**
- **Dokumentierter Datenbestand**
- **Spezielle Features für die Recherche, z.B. Patentstatistiktools, Patentfamilien, Rechtsstände, Suche nach Zitierungen, Volltextsuche, Sortierfunktion, Einsicht in den Suchindex sind vorhanden**
- **Übergang zu kostenpflichtiger Volltextbeschaffung**
- **Verschiedene Anzeigemöglichkeiten, Nachbearbeitung der Recherche möglich**
- **Überwachungsrecherchen**
- **Beispiele: DELPHION, PATBASE, QPAT**

Datenbankdienstleister mit einer Reihe sich ergänzender Patentdatenbanken und benutzungsabhängigen Gebühren

- **Quasi vollständiges Angebot an wichtigen Patentdatenbanken**
 - Weltweite Erfassung von Patentpublikationen
 - Sehr aktuelle Informationen
 - Komprimierte Informationen aus qualitativ hochwertigen Datenbanken
 - Literaturdatenbanken
 - **Ein Rechner – eine Suchsprache – eine Benutzeroberfläche**
- **Dokumentierter Datenbestand**
- **Komfortable Such- und Anzeigefunktionen**
- **Mehrwertinformationen**
Die Informationen sind von Spezialisten evaluiert, indexiert, klassifiziert und in Form von Abstracts beschrieben
- **Sortiermöglichkeiten, Anzeige/Entfernen von Dubletten, parallele Suche in mehreren Datenbanken**
- **Statistische Patentanalyse, Erstellen von Rangreihen**

- **Komfortable Möglichkeiten zur Recherchevor- und -nachbereitung**
- **Beispiele:**

STN International

STNEASY: Benutzerfreundliches Recherchemenü für Anfänger oder gelegentlich recherchierende Wissenschaftler

STN Classic, STN on the WEB: Recherche mit einer Retrievalsprache

Kostenpflichtige Volltextbeschaffung

- umfangreiche Datensammlungen
- Einzel- und Listenbestellungen
- Lieferung per Post, Fax oder Online (als email attachment oder von einem Server abholbar)
- Ausgabe des kompletten Volltextes (Online in verschiedenen Formaten z.B. PDF, TIFF)
- **Kosten:** entweder ein Preis für komplettes Dokument oder Bereitstellungspreis + Seitenpreis; Abonnements
- **Beispiele:**
 - Patentämter
 - Patentinformationszentren
 - PATON: PATONline

Recherchemöglichkeiten - Beispiele

DEPATISNET

<http://www.depatiset.de>

Kurzbeschreibung

Zeitraum	ab 1790
Aktualität	abhängig vom Publikationsland
Update	wöchentlich
Sprache	Originalsprache (mehrsprachig)

Inhalt

- **Patentveröffentlichungen aus aller Welt, die sich im Datenbestand des amtsinternen deutschen Patentinformationssystems DEPATIS befinden**
- **Deutsche Gebrauchsmuster sind enthalten, keine Geschmacksmuster**
- **Recherche in Originalsprache der Dokumente, deutsch, englisch, französisch usw. (aber z.B. JP-Abstracts in englisch)**

- **Anzeige von bibliographischen Daten (Titel, Anmelder, Erfinder ...) eines gefundenen Dokuments**
- **Anzeige des Originaldokuments im PDF-Format**
- **Innerhalb des PDF-Dokuments kann seitenweise geblättert oder direkt auf bestimmte Dokumententeile ('Subdokumente') wie z.B. Ansprüche, Zeichnung, Beschreibung etc. gesprungen werden**
- **Ausdruck/Speicherung des Dokuments ist komplett möglich**
- **Titellisten können in Excel-Format überführt und bearbeitet werden**
- **3 Suchmodi:**
 - Einsteigerrecherche
 - Expertenrecherche
 - Ikofox-Recherche

Deutsche Patentschrift



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt



(10) **DE 101 10 969 B4** 2004.02.12

Patentnummer mit Publikationscode

Daten (Anmeldung, Veröffentlichung)

Patentschrift

(21) Aktenzeichen: **101 10 969.5**
(22) Anmeldetag: **07.03.2001**
(43) Offenlegungstag: **19.09.2002**
(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: **12.02.2004**

(51) Int. Cl.?: **G01B 11/16**
G01B 9/02, G01J 3/30

Internationale Patentklassifikation (IPC)

Innerhalb von ~~3 Monaten nach Veröffentlichung~~ der Erteilung kann Einspruch erhoben werden.

(71) Patentinhaber:
**Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg, vertreten
durch den Kanzler, 26129 Oldenburg, DE**

(74) Vertreter:
Jabbusch und Kollegen, 26135 Oldenburg

(72) Erfinder:
**Fricke-Begemann, Thomas, Dipl.-Phys., 32109
Bad Salzufen, DE**

Anmelder- und Erfinder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 198 56 398 A1
DE 196 39 213 A1
DE 195 21 551 A1
DE 195 09 962 A1
DE 41 16 345 A1
DE 41 02 881 A1
DE 40 13 309 A1
US 45 91 996
US 37 89 657
EP 00 23 643 A1
EP 3 47 912 A2
WO 877 365 A1

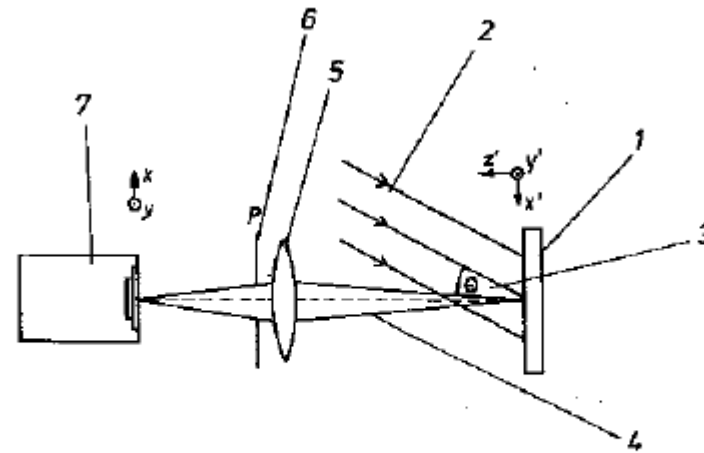
Zitierte Schriften

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Erfassung von out-of-plane-Oberflächenverformungen**

Titel

Zusammenfassung/Hauptanspruch und Zeichnung

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Erfassung von out-of-plane-Oberflächenverformungen eines Objektes, wobei das Objekt mit kohärentem Licht beleuchtet und das gemessene Streulicht ausgewertet, das unverformte Objekt mit kohärentem Licht beleuchtet und das Streulicht als Referenzbild erfaßt wird, das verformte Objekt mit kohärentem Licht beleuchtet und das Streulicht als Verformungsbild erfaßt wird und die jeweiligen Bilder miteinander verrechnet werden, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzbild und das Verformungsbild in einer der zu erzielenden Auflösung entsprechenden Anzahl von einander entsprechenden Unterbildern unterteilt werden, die einander entsprechenden Unterbilder verrechnet werden, und die bei der Verrechnung erhaltenen Funktionen bewertet werden, so daß für jedes Unterbild ein lokaler Kippwinkel ermittelt wird.



Suchmaske bei Einsteigerrecherche

Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.

Für weitere Informationen nutzen Sie die [Hilfe](#) zur Einsteigerrecherche.

Recherche formulieren

Veröffentlichungsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DE 4446098 C2 / DE 4446098
Titel	<input type="text"/>			Mikroprozessor
Anmelder	<input type="text"/>			Heinrich Schmidt
Erfinder	<input type="text"/>			Lisa Müller
Veröffentlichungsdatum	<input type="text"/>			12.10.1999
Bibliographische IPC	<input type="text"/>			F17D5/00
Reklassifizierte IPC	<input type="text"/>			F17D5/00
Anmeldedatum	<input type="text"/>			15.05.1998
Prüfstoff-IPC	<input type="text"/>			A01B1/02
Suche im Volltext	<input type="text"/>			Fahrrad

STN International

<http://www.stn-international.de>

STN International, The Scientific & Technical Information Network, ist ein weltweites Informationsnetz, das vom

- **Fachinformationzentrum (FIZ) Karlsruhe**
- **Japan Association for International Chemical Information (JAICI) / Tokio**
- **Chemical Abstracts Service (CAS) / Columbus Ohio**

gemeinsam betrieben wird. Mehr als 200 Datenbanken aus Wissenschaft und Technik mit Schwerpunkten in Chemie und Patenten stehen über dieses Informationsnetz ständig zugreifbar zur Verfügung.

Jede Organisation unterhält ein eigenes Service Zentrum, das die Offline Prints versendet, ein lokales Help Desk, die Datenübertragungseinrichtungen, und das Rechnungswesen.

STN-Patentdatenbanken (Auszug)

– INPADOCDB

Alle patentrelevanten Gebiete (Patente und Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster, incl. Familien- und Rechtsstand; weltweit)

– WPINDEX

Alle patentrelevanten Gebiete (Patente und Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster; wichtige Industrieländer incl. EP/PCT)

– PATDPA

Alle patentrelevanten Gebiete (DE-Patente und Patentanmeldungen, DE-Gebrauchsmuster, EP-Patente und Anmeldungen, PCT-Anmeldungen)

– PATDPAFULL

Alle patentrelevanten Gebiete (DE-Patente und Patentanmeldungen, DE-Gebrauchsmuster, Volltext)

– JAPIO

Alle patentrelevanten Gebiete (ungeprüfte japanische Patentanmeldungen)

– **USPATFULL**

Alle patentrelevanten Gebiete (U.S.- Patente und Patentanmeldungen u.a. Schutzrechtesarten, Volltext)

– **EPFULL**

Alle patentrelevanten Gebiete (EP-Patente und Anmeldungen, Volltext)

– **PCTFULL**

Alle patentrelevanten Gebiete (PCT-Anmeldungen, Volltext)

– **PCI**

Alle patentrelevanten Gebiete (Patentzitationen)

PATONline: Volltextbeschaffung

<http://www.patonline.tu-ilmenau.de/>

DE-A Deutsche Offenlegungsschriften	Seit 1976
DE-C Deutsche Patentschriften	Seit 1991
DE-T2 Deutsche Übersetzungen europäischer oder internationaler Patente	Seit 1992
DE-U Deutsche Gebrauchsmuster	Seit 1991
EP-A Europäische Patente	Seit 1978
EP-B Europäische Patente	Seit 1980
WO Internationale (PCT)-Anmeldungen	Seit 1979
US US-Patente, US-Applications	Seit 1790 Seit 3/2001
JP Englische Übersetzungen der Titelseiten japanischer Patentanmeldungen	Seit 1976
RU/SU Russische / Sowjetische Patente	Seit 1983
DD DDR	1950 -1990
FR-A Frankreich	1992
GB Großbritannien	Seit 1979 bis 1999

- **Gebühren**

- Patentvolltexte**

- Ausgabe als Papierkopie**

- Patentvolltexte bis max. 20 Seiten***

- Grundgebühr je Patentschrift** **0,90 €**

- Zuzüglich je Seite** **0,13 €**

- Patentvolltexte mit mehr als 20 Seiten***

- Gebühr je Patentschrift** **3,50 €**

- Ausgabe als CD-ROM (ab 100 Volltexte)**

- Titelseite oder Gesamtdokument** **Nach Vereinbarung**

- Beschaffen und Editieren maschineller Übersetzungen**

- Je Seite** **1,00 €**

- Weitere Informationen und Hinweise können Sie unter paton.line@tu-ilmenau.de erfragen

Durchführung von Patentrecherchen

Vorgehensweise

Vor der Recherche

- **Verstehen der Anfrage:**

- Formulierung des Recherchethemas – möglichst genau und möglichst umfassend
- Beschreibung des Recherchethemas, Abgrenzung von bereits Bekanntem und von nicht Gewünschtem
- Einordnung nach der Rechercheart

- **Formulieren der Suchkriterien:**

- Auswahl von charakteristischen Suchwörtern
- Ermittlung von Klassifikationen
- Namen bekannter Erfinder / Anmelder
- Nummern von bereits bekannten Patenten

Dabei müssen die Suchkriterien bestimmt werden, die den Kern der Anfrage repräsentieren. Bei dem Sachrecherchebeispiel „Bremsen für Inline-Skates“ z. B. stellt sich eine Reihe von Fragen:

- Gibt es andere Begriffe für Inline-Skates? – z. B. Rollerblades (oder Roller-Blades), Rollschuhe
- Ist es wichtig, ob die Bremsen speziell für Inline-Skates sind – oder könnte die gesuchte Bremse auch an anderen Rollschuhen verwendet werden? – ggf. kann das Wort „Inline“ wegfallen
- Welche von den verschiedenen Klassen soll(en) verwendet werden? – Es sollte immer versucht werden, möglichst genau zu klassifizieren.
- Gibt es bekannte Firmen, die im Ergebnis auftauchen sollten? – ggf. kann man daran das Rechercheergebnis kontrollieren
- Sind bereits Patentschriften bekannt? – ggf. kann man daraus Hinweise für die Gestaltung der Recherchestrategie entnehmen

- **Auswahl des Recherchemediums**

- Je nach Vorkenntnissen, Aufgabengebiet, Firmengröße, Firmenstruktur müssen Sie entscheiden, wo und mit welchen Recherchemedien Sie die Patentrecherchen durchführen und welchen Volltextservice Sie nutzen möchten.
- Zusätzlich muss entschieden werden, in welchen Datenbanken recherchiert werden soll. Das hängt von folgenden Aspekten ab:

Thema

Länder, die erfasst werden sollen

Recherchearten

Durchführung der Recherche

- **Eingabe der Suchbegriffe und Verknüpfungen**
- **Überprüfung des Rechercheergebnisses**
 - Auswertung der Trefferzahl
 - Überprüfung der Titel
- **Verfeinern der Suche / Neue Suche**
 - abhängig vom Ergebnis der Recherche
 - kann evtl. übersprungen werden
- **Anzeige der Dokumente oder ausgewählter Dokumente, eventuell Volltextanzeige oder Volltextbestellung**

Nach der Recherche

- **Auswertung und Zusammenstellung der Ergebnisse**
- **Erstellung eines Rechercheberichtes**

Die Internationale Patentklassifikation (IPC)

Patentfachsprache

Ein Patentanmelder versucht die Anmeldung so zu formulieren, dass ein möglichst breiter Schutz entsteht. Teilweise werden auch bestimmte Formulierungen gewählt, um zu verhindern, dass ein Patent gefunden wird. Dadurch entsteht eine Patentfachsprache, in der eher breite Konzepte anstatt intuitiver Schlagworte verwendet werden:

Gartenzwerg	Aufstellfigur mit einer stilisierten Darstellung Aufstellfigur mit einem als Hohlkörper ausgebildeten Figurenkörper
Spirale	Energiespeichereinrichtung
Batterie	Energiespeichereinrichtung
Transistor	Halbleiterschaltgerät mit Steuerelektrode
Inline-Skate	Rollschuh mit in einer Linie hintereinander angeordneten Rollen
Kopfhörer	Audio-System

IPC

- sprachunabhängig
- wird in allen Patentedokumenten weltweit verwendet
- Hierarchisches Verzeichnis im WEB (DEPATISNET)

<http://depatisnet.dpma.de/ipc/>

IPC-Startseite | Drucken | Hilfe | English

Deutsches Patent- und Markenamt

Internationale Patentklassifikation

IPC-Verzeichnis | IPC-Recherche | IPC-Konkordanz

A	<u>Sektion A – Täglicher Lebensbedarf</u>
B	<u>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</u>
C	<u>Sektion C – Chemie; Hüttenwesen</u>
D	<u>Sektion D – Textilien; Papier</u>
E	<u>Sektion E – Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</u>
F	<u>Sektion F – Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen</u>
G	<u>Sektion G – Physik</u>
H	<u>Sektion H – Elektrotechnik</u>

IPC-Symbol, z.B. C08B 11/193:

Sprache:
 DE EN FR

IPC-Ausgabe/Version:
2008.04(aktuell)

Anzeigeoptionen

maximale Punkthierarchie:
alle

Hierarchie
 DEKLA-Gruppen
 Anmerkungen
 Sachverzeichnisse
 Stich- und Schlagworte

Die Internationale Patentklassifikation (IPC) ist ein hierarchisches System mit folgendem Aufbau (Klassifikationsbeispiel *Inline-Skates*):

A	Sektion	Sektion A — Täglicher Lebensbedarf
A63	Klasse	Sport, Spiele, Volksbelustigungen
A63C	Unterklasse	Schlittschuhe ; Ski ; Rollschuhe ; Entwurf oder Anordnung von Spielplätzen, Sportbahnen oder dgl. [5]
A63C 17	Gruppe	Rollschuhe ; Rollbretter [4]
A63C 17/00	Hauptgruppe	Rollschuhe ; Rollbretter [4]
A63C 17/01	Untergruppe	. Rollbretter (A63C 17/02 - A63C 17/28 haben Vorrang) [4]
A63C 17/02	Untergruppe	. mit zweipaarig angeordneten Rollen
A63C 17/04	Untergruppe	. mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen
A63C 17/06	Untergruppe	. . einspurige Rollschuhe
A63C 17/08	Untergruppe	. . . Einradrollschuhe

Die IPC wird von der WIPO (World Intellectual Property Organisation) festgelegt.

Komplexe Patentrecherchen von der Entwicklung bis zur Vermarktung

Technologierecherche / Recherche nach dem Stand der Technik (State of the Art Search)

Welche Technologien wurden im Bereich Einsatz von UWB-Radar im Automobil veröffentlicht?

Sie möchten Ihre Forschungsarbeiten intensivieren, um neue Produkte zu entwickeln. Sie möchten wissen, wie der Stand der Technik auf Ihrem Fachgebiet ist. Solche Technologierecherchen können sehr breit angelegt werden (Patente, wissenschaftlich-technische Fachliteratur, Wirtschaftsinformationen).

Zur Vermeidung von Doppelarbeit in Forschung und Entwicklung sollten vor und während Entwicklung neuer Produkte Informationsrecherchen durchgeführt werden.

Neuheitsrecherche (Novelty Search)

Ich habe ein intelligentes Fahrsicherheitssystem entwickelt. Ist das eine Neuheit?

Es wird in Erfahrung gebracht, welchen technischen Fortschritt ihre Erfindung gegenüber bereits veröffentlichten Entwicklungen aufweist.

Eine Neuheitsrecherche wird i.d.R. abgebrochen, sobald zwei bis drei neuheitsschädliche Dokumente gefunden werden.

Patentierbarkeitsrecherche (Patentability Search)

Ich möchte das intelligente Fahrsicherheitssystem patentieren lassen und habe die Ansprüche schon im Entwurf vorliegen. Wie sollten die Patentansprüche genau definiert werden, um einerseits einen möglichst hohen Schutzzumfang zu haben aber andererseits keine anderen Schriften zu verletzen.

Bei Neuheits- und Patentierbarkeitsrecherchen werden Patent- und Literaturpublikationen ermittelt, die für die Patentfähigkeit einer Erfindung relevant sein könnten. Sie sollten vor der Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung durchgeführt werden.

Die Begriffe Neuheits- und Patentierbarkeitsrecherchen werden auch synonym verwendet.

Einspruchsrecherchen (Opposition Search) oder Gütigkeitsrecherche (Validity Search)

Ein Wettbewerber hat ein Patent angemeldet und ich möchte verhindern, dass dieses Patent Gültigkeit erreicht. Dafür werden Hinweise benötigt, dass eine Beschreibung der beanspruchten Technologie schon vor der Anmeldung öffentlich zugänglich war.

Es kann die Einspruchsfrist nach Erteilung genutzt werden, um die notwendigen Informationen zu sammeln, um sich der Erteilung des Patents entgegenzustellen. In der Einspruchsrecherche werden relevante Publikationen vor dem Prioritätsdatum des interessierenden Patents gesucht.

Wenn die Einspruchsfrist verpasst wurde oder wenn ein nationales Patentrecht keinen Einspruch zulässt werden Gütigkeitsrecherchen durchgeführt, um die Erteilung eines Patents als rechtsungültig zu erklären.

Patentverletzungsrecherche (Infringement Search)

Wie kann ich herausfinden, ob das Produkt, das ich herstellen möchte, ein anderes Patent verletzt?

Es wird nach noch nicht abgelaufenen Patenten gesucht, die die Herstellung, Nutzung oder den Verkauf eines bestimmten Produktes, Verfahrens oder Prozesses verbieten. So können Sie sich vor einer möglichen Klage schützen.

Ausübungsfreiheitsrecherche (Freedom to Operate Search)

Wie kann ich herausfinden, ob auch Teile des Produkts, das ich herstellen möchte, irgendwie geschützt sein könnten? Wie hoch ist das Risiko, durch Patente anderer Firmen behindert zu werden?

Hier wird nicht nur nach aktiven Patenten gesucht, die verletzt werden könnten, sondern auch nach abgelaufenen Patenten oder publizierter Literatur, durch die eine Technologie freigehalten wird. Es sollen Freiräume für die Technologieauswahl identifiziert werden

Überwachungsrecherchen (Patent Monitoring)

Wie kann ich immer auf dem Laufenden sein, was in meinem Fachgebiet neu ist und welche Patente meine Wettbewerber veröffentlichen?

- **Überwachung eines Fachgebietes (Sachrecherche):**

- Prüfung neuer Patente und Gebrauchsmuster im Fachgebiet auf mögliche Verletzung
- Beobachtung technischer Trends, aktiver Firmen ((Konkurrenz oder Kooperationspartner), Bestimmungsmärkte

- **Überwachung von Konkurrenzfirmen mittels Namensrecherche:**

- Prüfung neuer Patente und Gebrauchsmuster der Wettbewerber auf mögliche Verletzungen
- Beobachtung der Bestimmungs- /Absatzmärkte der Wettbewerber
- Beobachtung der Schwerpunktforschungsgebiete / des Patentportfolios

- **Überwachung von Patentfamilien / Rechtsständen:**
 - Beobachtung von Patentfamilien hinsichtlich neuer Familienmitglieder (Äquivalente)
 - Verfolgung von Patentverfahren auf Erteilung, Erlöschen, Eintritt in die nationale Phase usw.
 - Beobachtung der Zielländer
- **Überprüfung der Zitierungen der eigenen Firma**
 - Wo werden die eigenen Patente zitiert?
 - Überprüfung möglicher Verletzungen

Patentstatistische Analysen

Patentdatenbanken sind sehr vollständige und gut aufbereitete Quellen von technologischen Informationen. Sie eignen sich für

- **Unternehmensanalysen**
- **Konkurrenzanalysen**
- **Technologieanalysen**

Patentanalysen können als Entscheidungshilfe für die strategische Planung innerhalb des Unternehmens dienen.

Voraussetzungen zur Erstellung von aussagekräftigen Patentanalysen sind

- **Die Verwendung geeigneter Datenbanken**
- **Gute Datenbankkenntnisse des Rechercheurs**
- **Gute Recherchekenntnisse des Rechercheurs**
- **Verwendung geeigneter Statistiktools zur Recherche und Visualisierung der Ergebnisse**

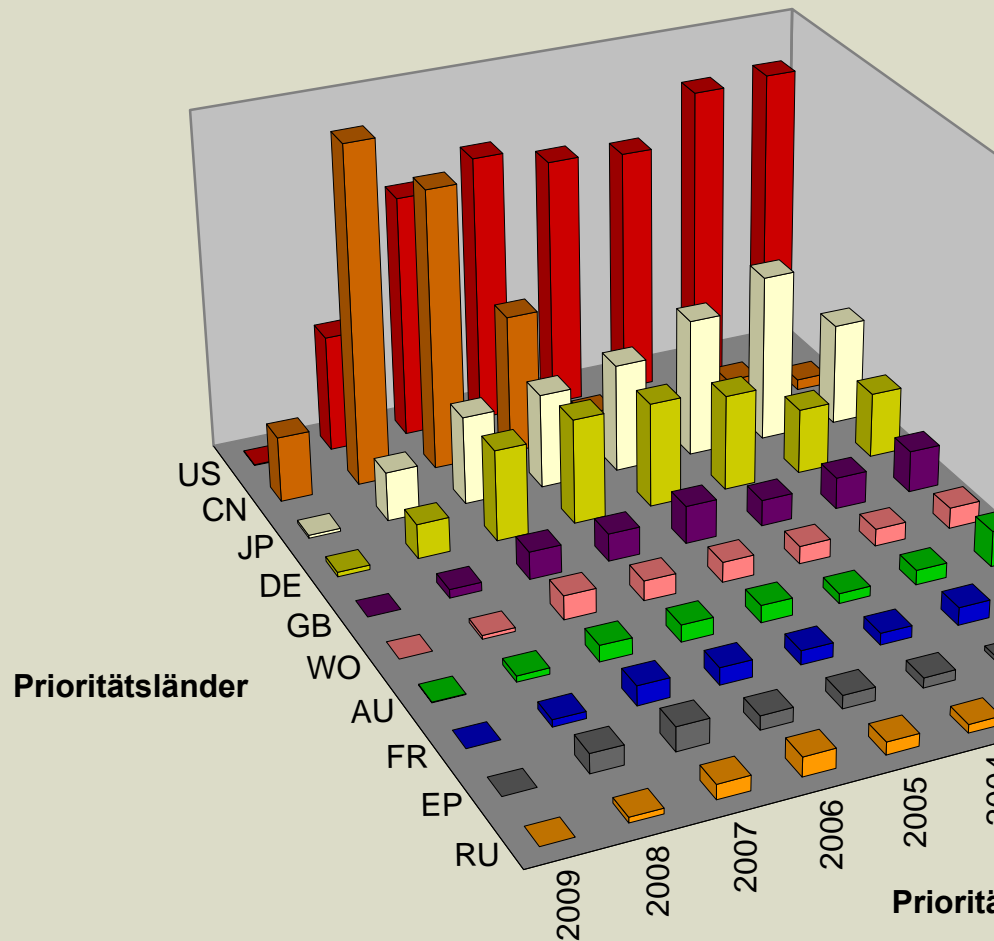
Patentstatistische Analysen können auf folgende Fragestellungen Antwort geben

- **Wie verlaufen die Entwicklungstrends bei bestimmten Technologien, nehmen die Aktivitäten in Forschung und Entwicklung zu oder ab?**
 - es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Patenten und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
 - Patente werden 2 bis 6 Jahre angemeldet und publiziert bevor neue Produkte auf den Markt kommen, somit können frühzeitig technologische Entwicklungen erkannt werden
- **Welche Unternehmen und Personen sind beteiligt? Welche Unternehmen sind die Technologieführer?**
- **Aus welchen Ländern stammen die Patentanmelder eines bestimmten Technologiefeldes?**
- **In welchen Ländern schützen die Patentanmelder eine bestimmte Technologie, bzw. für welche Länder erwarten diese Firmen einen Markt?**
- **Welche Erfinder sind auf einem wichtigen Fachgebiet aktiv?**
- **Existieren bisher unbekannte Anwendungsbereiche für unser Technologiefeld?**

- **In welche Richtungen orientieren sich die einschlägig tätigen Unternehmen am stärksten? Welches sind die Wettbewerber/Kooperationspartner?**
- **Welches sind die Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte, Patentstrategien und Absatzmärkte der Wettbewerber?**
- **Welches sind die Technologiebereiche eines bestimmten Unternehmens? Wie stark sind diese?**
 - Wie haben sich die Anmeldezahlen, die Erteilungsquote und die Auslandsanmeldungen entwickelt?
- **Welcher Patentanwalt ist erfahren in einer bestimmten Technologie? Wie ist seine Erteilungsquote? Welche Firmen werden vertreten?**

Analysebeispiel: Medizinische Beatmungssysteme

Analyse der **Prioritätsländer zu den Prioritätsjahren**, Fachgebiet **Medizinische Beatmungssysteme**,
weltweit
Datum: 21.01.2010, WPINDEX



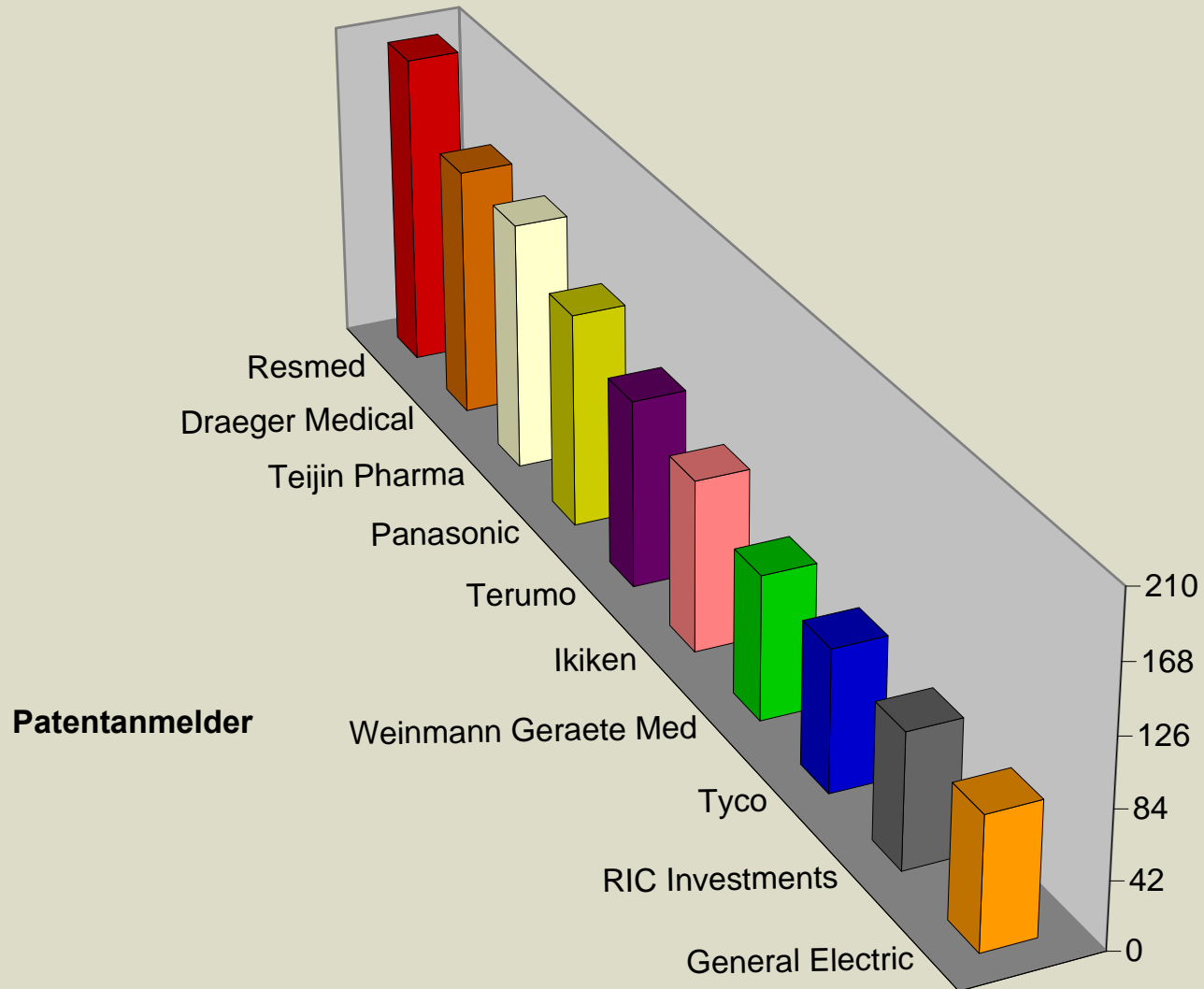
1. Recherche nach dem Fachgebiet:
**Medizinische Beatmungssysteme
(H01L31/042)**

2. Analyse Ursprungsländer über
Ursprungsjahre

3. Ergebnis der Analyse:

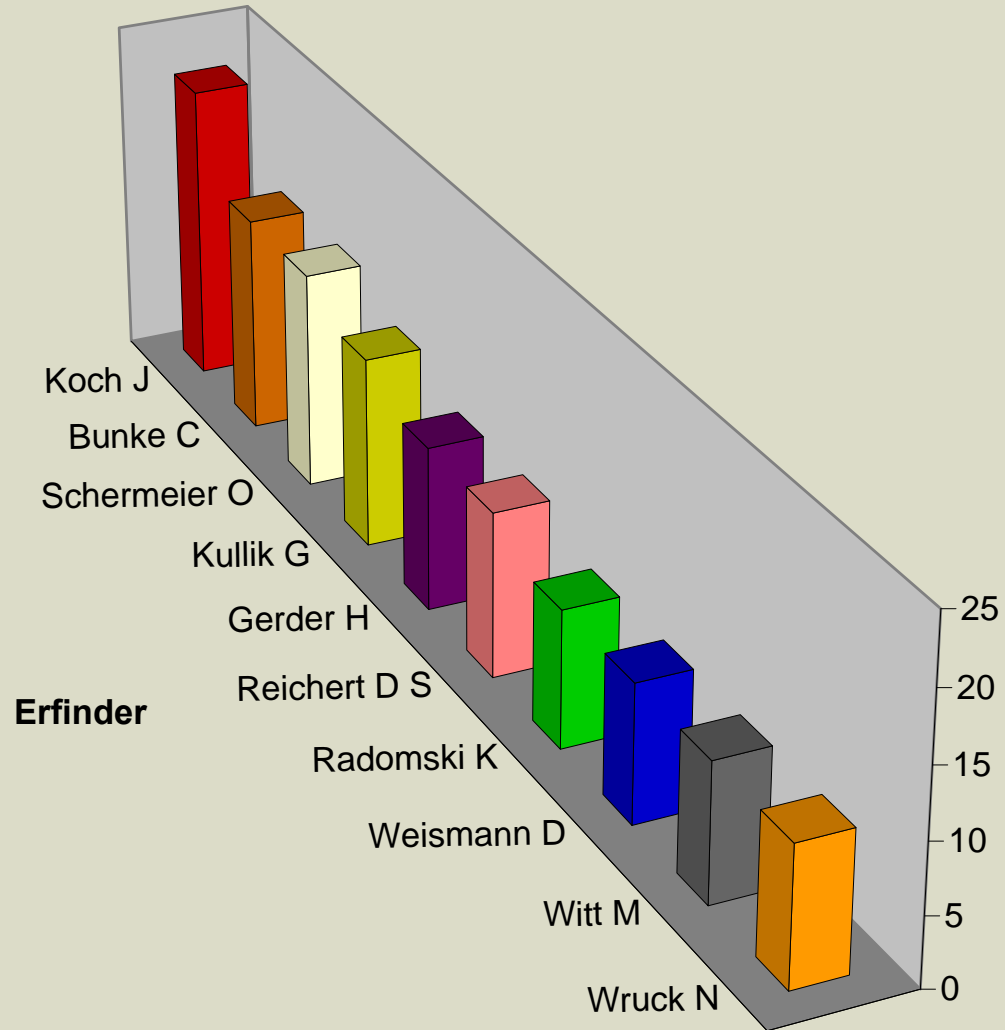
- Die meisten Patente werden in den USA angemeldet aber mit fallender Tendenz
- Stark steigende Anmeldezahlen in China
- Fallende Anmeldezahlen in Japan
- Steigende Anmeldezahlen in Deutschland

Analyse **Patentanmelder, Medizinische Beatmungssysteme** ab 2001, weltweit,
Datum: 21.01.2010, Quelle: WPINDEX



1. Analyse der Patentanmelder (Zahl der Ursprungsanmeldungen)

Analyse **Erfinder** der Firma **Dreager Medical** auf dem Gebiet der **Medizinischen Beatmungssysteme**,
ab 2001, Datum: 21.01.2010, Quelle: WPINDEX



Patentinformationszentrum

Ein Patentinformationszentrum wie das PATON bietet Ihnen folgende Möglichkeiten zur Qualifizierung für und zur Durchführung von Patentrecherchen an:

Recherchen im Kundenauftrag

- **Patente, Marken und Geschmacksmuster, Fach- und Wirtschaftsliteratur, Juristische Informationen**
- **Service**
 - Beratung zu Formulierung und Klassifizierung des Recherchethemas
 - kostenlose Angebotserstellung
 - Erstellen von Rechercheberichten im Ergebnis der Online-Recherche (mit Lieferung der Patentvolltexte bzw. Ergebnisdateien mit Volltext-Links)
 - Sofort-Bonitätsauskünfte zu deutschen Unternehmen
- **Voraussetzungen der Nutzer für die Recherche**
 - Kenntnisse der fachlichen Probleme / Rechercheanfragen

Betreute Nutzerrecherchen in CD-ROM- und WEB-Datenbanken und Papierbeständen im Recherchesaal

- **Recherchen**
 - Beratung zur Recherchestrategie
 - Betreute Recherchen in Schutzrechts-, Fachliteratur- und Wirtschaftsdatenbanken
 - Bereitstellung von Volltexten und Fachliteratur zum Gewerblichen Rechtsschutz
 - Kostenfreie Erfindererstberatung durch Patentanwälte
- **Voraussetzungen der Nutzer für die Recherche**
 - Kenntnisse der fachlichen Probleme / Rechercheanfragen
 - PC-Grundkenntnisse

Bildungszentrum

- **Studentenausbildung an der TU für:** Fach- und Patentinformation
- **Zielgruppe für Weiterbildungsangebot:** Personen aus Wissenschaft und Technik, die sich in Richtung Patentwesen und Fachinformation /Datenbankrecherchen qualifizieren möchten
- **Seit 1991 STN-Schulungspartner**
- **Seminarziel:** Aneignung von Kenntnissen zur Vorbereitung, Durchführung und Aus- und Bewertung von Recherchen und für die Anmeldung und Verwaltung von Schutzrechten
 - Selbständig durchgeführte Recherchen im WEB
 - Selbständig durchgeführte Recherchen im Recherchesaal
 - Selbständig durchgeführte Recherchen in STN-Online-Datenbanken
 - Erstellen von Rechercheaufträgen
 - Lesen und Bewerten von Patentschriften
 - Vorbereitung von Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken)
 - Aufbau eines Patentarchivs

Zusammenfassung: Recherchemöglichkeiten

	Kostenfreie Angebote im WEB	Auftragsrecherchen	STN-Patentdatenbanken STN Classic / STN on the WEB
Vorkenntnisse zur Patentinformation	notwendig	wünschenswert	notwendig
Bedienung der Benutzeroberflächen	einfach bis kompliziert	nicht notwendig	Erlernen der STN-Recherchesprache notwendig
Vollständigkeit der Recherchen	schwer zu erreichen, nicht vollständig dokumentierter Datenbestand	vollständige Recherche in dokumentierten weltweiten Fonds möglich	vollständige Recherche in dokumentierten weltweiten Fonds möglich
Volltextbeschaffung	relativ komfortabel, kostenfrei	umfassend im Angebot, kostenpflichtig	relativ komfortabel kostenfrei/kostenpflichtig
Zeitaufwand für den Nutzer zur Durchführung der Recherchen	hoch	sehr gering	gering
Sonderfunktionen z. B. Patentstatistik -	Nicht realisiert	im Angebot	gut durchführbar
Erstellung von Rechercheberichten	umständlich, kaum Unterstützung durch Oberflächen	Bericht wird erstellt	gut möglich, gute Unterstützung durch Oberfläche
Kosten	Angebot kostenfrei, Kosten durch Arbeitszeit und Provider	Kosten für die komplette Recherche mit Bericht hoch, aber geringe Zusatzkosten	Recherchekosten relativ hoch, Einarbeitungsaufwand relativ hoch
Auswertung der Recherchen	Kenntnisse zum Patentwesen notwendig	Kenntnisse zum Patentwesen notwendig / Unterstützung durch Vorarbeit der Rechercheure	Kenntnisse zum Patentwesen notwendig

Elke Thomä

**TU Ilmenau, PATON | Landespatentzentrum Thüringen
PF 100565**

98684 Ilmenau

Tel: 03677 69 4507

Fax: 03677 69 4538

Email: elke.thomae@tu-ilmenau.de

WEB: www.paton.tu-ilmenau.de